



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

测定晶内第二相在基体中分布均匀性的方法

文献类型: 专利

作者 李阎平;张利峰;李明远;王练;彭胜;吴松全;高博;顾恒飞;庞丽侠

发表日期 2016-08-17

专利国别 中国

专利类型 发明

权利人 李阎平;张利峰;李明远;王练;彭胜;吴松全;高博;顾恒飞;庞丽侠

中文摘要 测定晶内第二相在基体中分布均匀性的方法

公开日期 2016-08-17

申请日期 2013-10-29

语种 中文

专利申请号 201310525910.7

源URL [<http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/78806>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 李阎平,张利峰,李明远,等. 测定晶内第二相在基体中分布均匀性的方法. 2016-08-17.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
53	0	0

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。